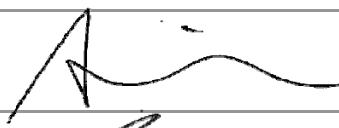
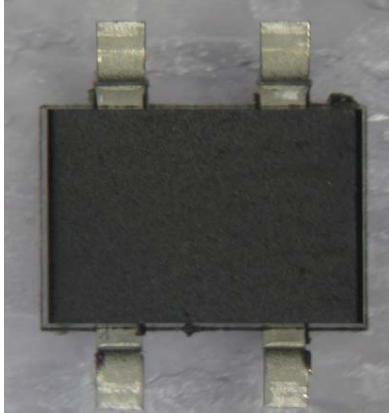
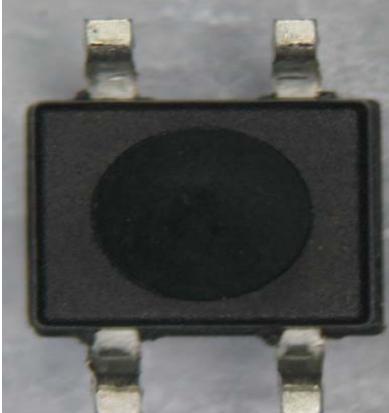


## Product/Process Change Notification

PCN#	Effective Date	Issue Date
2013-06-17C-01	2013/12/17	2013/6/17
PCN Classification	Product Category	
Major	Bridge Diode	
	Subject	
Change assembly factory for MDS package		
Affected Product(s)		
MD1S~MD7S		
Description of Change(s)		
Original assembly factory EOL, thus Change assembly factory.		
Content of Change(s)		
Assembly factory		
Impact(s)		
None		
Attachment(s)		
Reliability test report. Package information. Specification.		

Approval		
Issue by	Alice Lai	e-mail: alice@secosgmbh.com
Development Engineer		Alice Lai
QA Manager		Peter Yang
General Manager		Mathew Liu

For more information, please contact us directly or visit our website <http://www.secogsmbh.com>

Exterior comparison Chart	
Original	News
	
Top View	Top View
	
Rear View	Rear View
	
Reel	Reel

RoHS Compliant Product  
A suffix of "-C" specifies halogen & lead-free

## FEATURES

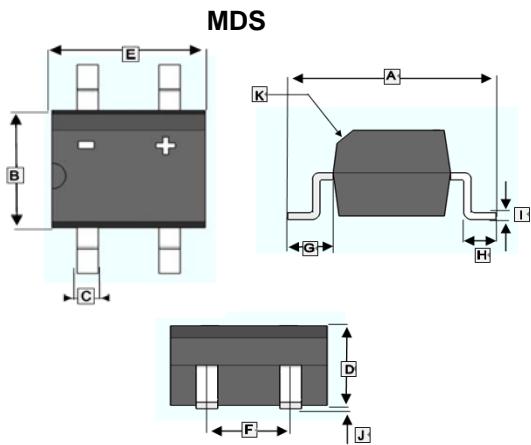
- Plastic material has UL flammability classification 94V-0
- High surge current capability
- Saves space on printed circuit boards
- Glass passivated structure

## MECHANICAL DATA

- Case: Molded plastic body over passivated junctions
- Polarity: As marked on body
- Mounting position: Any

## PACKAGE INFORMATION

Package	MPQ	Leader Size
MDS	3K	13 inch



REF.	Millimeter		REF.	Millimeter	
	Min.	Max.		Min.	Max.
A	-	7.0	G	1.3	1.7
B	3.5	4.2	H	0.48	1.1
C	0.4	0.8	I	0.1	0.45
D	2.3	2.7	J	0.2(TYP.)	
E	4.5	5.0	K	0.5*15	
F	2.3	2.7			

## MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Rating 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Single phase half wave, 60Hz, resistive or inductive load.  
For capacitive load, de-rate current by 20%.)

Parameter	Symbol	Part Number							Unit
		MD1S	MD2S	MD3S	MD4S	MD5S	MD6S	MD7S	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	$V_{RMS}$	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	$V_{DC}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current P.C.B.	$I_{F(AV)}$	0.5							A
On aluminum substrate		0.8							
Peak Forward Surge Current 8.3 ms Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load (JEDEC Method)	$I_{FSM}$	30							A
Maximum instantaneous forward voltage @ 0.4A per leg	$V_F$	1							V
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	$T_A=25^\circ\text{C}$	$I_R$	5						$\mu\text{A}$
	$T_A=125^\circ\text{C}$		500						
Rating for fusing, $1\text{ms} \leq t \leq 8.3\text{ms}$	$I_T^2$	5							$\text{A}^2\text{s}$
Thermal resistance junction to ambient <sup>1</sup>	$R_{\theta JA}$	85							$^\circ\text{C/W}$
Thermal resistance junction to lead <sup>1</sup>	$R_{\theta JL}$	20							$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature range	$T_J, T_{STG}$	-55~150							$^\circ\text{C}$

Note:

1. On glass epoxy P.C.B. mounted on  $0.05 \times 0.05$ " (1.3x1.3mm) pads
2. On aluminum substrate P.C.B. with area of  $0.8'' \times 0.8''$  (20x20mm) mounted on  $0.05 \times 0.05$ " (1.3x1.3mm) solder pad

## RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES

FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

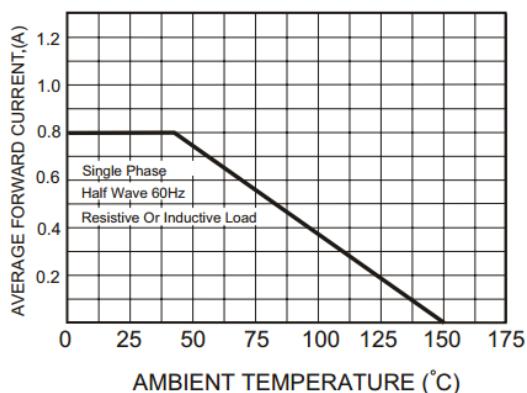


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

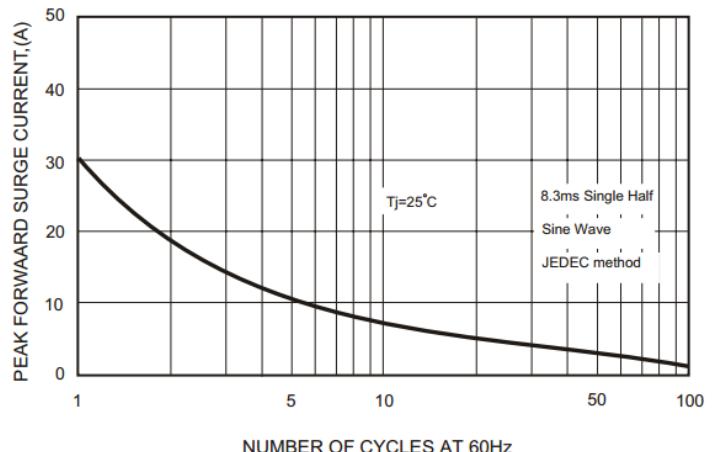


FIG.3-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

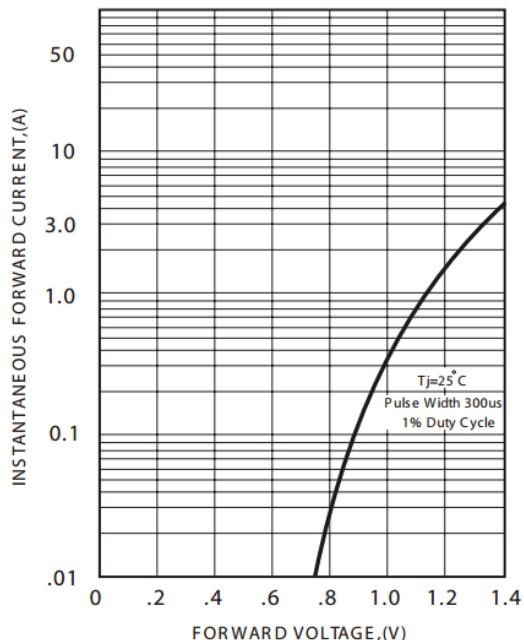
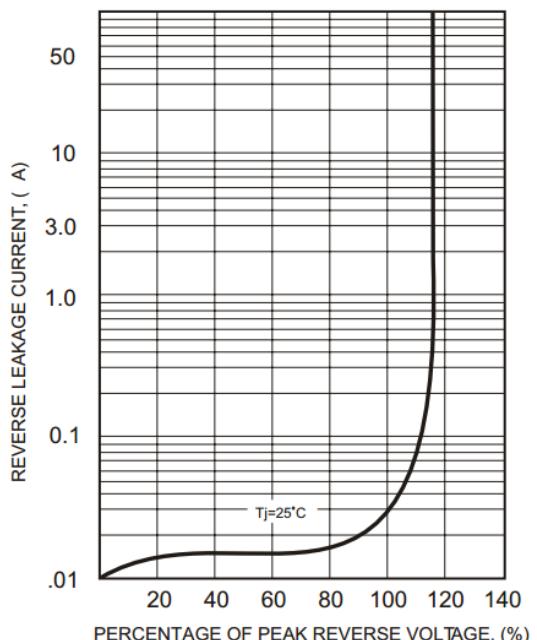
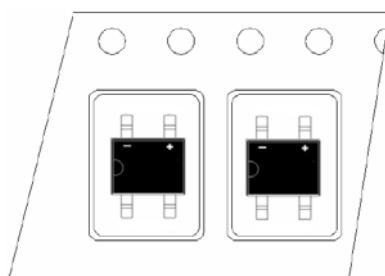
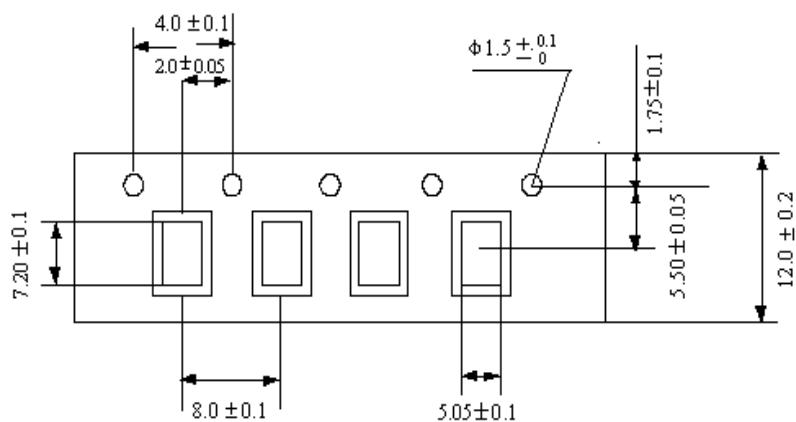
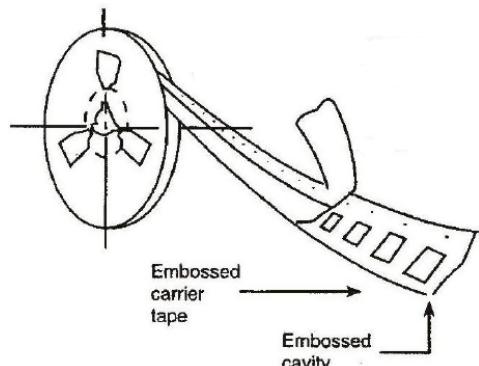
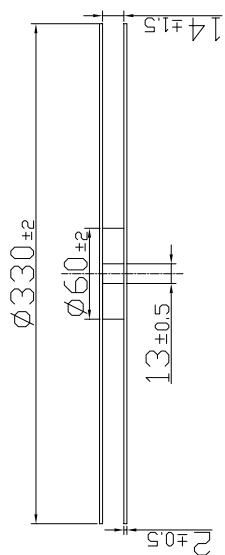
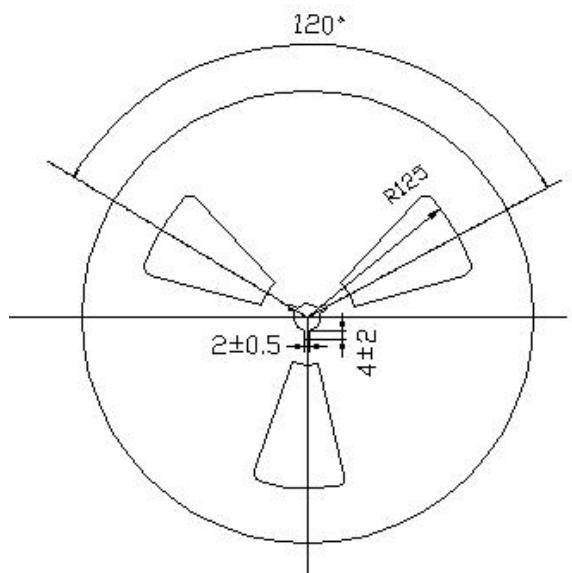


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



## MDS



**Unit: mm**

Reel	Reel Size	Box	Box Size (mm)	Carton	Carton Size (mm)
3,000pcs	13 inch	6,000 pcs	350*350*40	48,000	350*350*350

## Reliability Testing Summary Report

Date: 2013/05/31

Document No.: SG13 -04- 009

Test Item	P/N	Test Condition	(LTPD)	Sample Numbers	Allow Fall Numbers	Fall Numbers	Result
HTRB High Temp Reverse Bias	MD5S	100 ± 5°C, 80%VR, T = 1000hrs		77	0	0	ACC
HTSL High Temperature Storage Life	MD5S	150°C, T = 1000 hrs		77	0	0	ACC
PCT Pressure Cooker Test	MD5S	121°C, 29.7PSIG, 168 hrs		77	0	0	ACC
TCT Temperature Cycle Test	MD5S	-55°C/30min, 150°C/30min, For 1000 Cycle		77	0	0	ACC
THT High Temperature High Humidity Test	MD5S	85 ± 2°C, RH=85±5%, 1000 hrs		77	0	0	ACC
Solder Resistance DITY	MD5S	270±5°C, 7Sec +2/-0 Sec		10	0	0	ACC
<b>Judgment:</b>							
<input checked="" type="checkbox"/> qualified <input type="checkbox"/> unqualified							
Testing Start Date: <u>2013.04.01</u> Testing End Date: <u>2013.05.31</u>							
Tester: <u>King Huang</u> Approval: <u>Peter Yang</u>							



# SeCoS Corporation

## Electrical Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@if=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 25°C

Test Date: 2013.04.01 ~ 2013.04.01

Test Standard : Specifications

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	VF (mV)	IR (uA)
1	899mV	0.07uA
2	904mV	0.10uA
3	894mV	0.04uA
4	892mV	0.05uA
5	890mV	0.07uA
6	893mV	0.05uA
7	904mV	0.05uA
8	890mV	0.06uA
9	897mV	0.10uA
10	905mV	0.09uA
11	899mV	0.03uA
12	906mV	0.05uA
13	899mV	0.04uA
14	892mV	0.04uA
15	904mV	0.07uA
16	901mV	0.06uA
17	895mV	0.07uA
18	894mV	0.09uA
19	894mV	0.05uA
20	907mV	0.09uA
21	907mV	0.07uA
22	895mV	0.03uA
23	907mV	0.09uA
24	901mV	0.02uA
25	897mV	0.08uA
26	909mV	0.02uA
27	901mV	0.08uA
28	898mV	0.05uA
29	908mV	0.07uA
30	909mV	0.06uA
31	908mV	0.08uA
32	904mV	0.05uA
33	893mV	0.03uA
34	891mV	0.07uA
35	909mV	0.04uA
36	908mV	0.03uA
37	900mV	0.06uA
38	908mV	0.06uA
39	892mV	0.03uA
40	901mV	0.08uA
41	898mV	0.08uA



# SeCoS Corporation

## Electrical Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 25°C

Test Date: 2013.04.01 ~ 2013.04.01

Test Standard : Specifications

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	VF (mV)	IR (uA)
42	891mV	0.04uA
43	909mV	0.04uA
44	906mV	0.06uA
45	895mV	0.05uA
46	907mV	0.05uA
47	894mV	0.10uA
48	891mV	0.03uA
49	894mV	0.08uA
50	908mV	0.05uA
51	902mV	0.07uA
52	899mV	0.09uA
53	891mV	0.04uA
54	891mV	0.04uA
55	899mV	0.06uA
56	891mV	0.05uA
57	903mV	0.08uA
58	894mV	0.06uA
59	901mV	0.04uA
60	895mV	0.04uA
61	901mV	0.07uA
62	898mV	0.06uA
63	891mV	0.04uA
64	901mV	0.10uA
65	906mV	0.07uA
66	906mV	0.07uA
67	906mV	0.09uA
68	896mV	0.03uA
69	905mV	0.07uA
70	903mV	0.08uA
71	892mV	0.07uA
72	902mV	0.03uA
73	891mV	0.09uA
74	910mV	0.08uA
75	909mV	0.06uA
76	900mV	0.06uA
77	908mV	0.04uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



**SeCoS Corporation**

## High Temperature Reverse Bias Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 100 ± 5°C, 80%VR, T = 1000 hrs

Test Date: 2013.04.02 ~ 2013.05.14

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A108

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	910mV	0.07uA	896mV	0.07uA
2	894mV	0.08uA	908mV	0.07uA
3	891mV	0.08uA	909mV	0.05uA
4	890mV	0.10uA	902mV	0.06uA
5	895mV	0.03uA	904mV	0.10uA
6	898mV	0.04uA	902mV	0.05uA
7	893mV	0.07uA	903mV	0.04uA
8	895mV	0.06uA	890mV	0.10uA
9	903mV	0.02uA	905mV	0.10uA
10	895mV	0.03uA	893mV	0.03uA
11	907mV	0.04uA	899mV	0.07uA
12	899mV	0.08uA	907mV	0.04uA
13	891mV	0.10uA	892mV	0.10uA
14	901mV	0.08uA	902mV	0.03uA
15	899mV	0.07uA	897mV	0.09uA
16	900mV	0.10uA	900mV	0.09uA
17	905mV	0.04uA	909mV	0.09uA
18	897mV	0.08uA	901mV	0.09uA
19	899mV	0.03uA	900mV	0.06uA
20	910mV	0.06uA	901mV	0.05uA
21	907mV	0.10uA	893mV	0.04uA
22	901mV	0.09uA	899mV	0.09uA
23	896mV	0.08uA	908mV	0.06uA
24	909mV	0.04uA	905mV	0.09uA
25	907mV	0.06uA	899mV	0.06uA
26	907mV	0.09uA	897mV	0.03uA
27	905mV	0.05uA	907mV	0.05uA
28	895mV	0.08uA	891mV	0.07uA
29	899mV	0.08uA	894mV	0.04uA
30	904mV	0.08uA	901mV	0.10uA
31	897mV	0.04uA	895mV	0.07uA
32	903mV	0.07uA	903mV	0.03uA
33	905mV	0.06uA	905mV	0.08uA
34	900mV	0.09uA	900mV	0.02uA
35	899mV	0.03uA	904mV	0.07uA
36	900mV	0.08uA	897mV	0.03uA
37	906mV	0.02uA	897mV	0.03uA
38	908mV	0.02uA	904mV	0.09uA
39	902mV	0.04uA	903mV	0.10uA



**SeCoS Corporation**

## High Temperature Reverse Bias Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 100 ± 5°C, 80%VR, T = 1000 hrs

Test Date: 2013.04.02 ~ 2013.05.14

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A108

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
40	907mV	0.07uA	899mV	0.08uA
41	897mV	0.09uA	906mV	0.06uA
42	906mV	0.10uA	900mV	0.09uA
43	907mV	0.09uA	900mV	0.05uA
44	908mV	0.05uA	894mV	0.09uA
45	898mV	0.07uA	896mV	0.04uA
46	897mV	0.06uA	908mV	0.07uA
47	903mV	0.09uA	896mV	0.06uA
48	902mV	0.08uA	897mV	0.08uA
49	896mV	0.05uA	907mV	0.03uA
50	900mV	0.09uA	896mV	0.04uA
51	898mV	0.05uA	891mV	0.09uA
52	909mV	0.07uA	903mV	0.06uA
53	906mV	0.09uA	906mV	0.07uA
54	904mV	0.07uA	896mV	0.03uA
55	892mV	0.04uA	902mV	0.08uA
56	902mV	0.09uA	908mV	0.06uA
57	896mV	0.04uA	900mV	0.04uA
58	894mV	0.06uA	906mV	0.07uA
59	903mV	0.03uA	902mV	0.09uA
60	903mV	0.09uA	901mV	0.07uA
61	900mV	0.03uA	894mV	0.06uA
62	901mV	0.03uA	898mV	0.05uA
63	905mV	0.02uA	895mV	0.03uA
64	904mV	0.07uA	897mV	0.05uA
65	900mV	0.08uA	904mV	0.05uA
66	909mV	0.09uA	904mV	0.06uA
67	891mV	0.10uA	904mV	0.09uA
68	903mV	0.09uA	891mV	0.10uA
69	899mV	0.09uA	897mV	0.10uA
70	895mV	0.05uA	903mV	0.06uA
71	903mV	0.09uA	907mV	0.08uA
72	907mV	0.10uA	905mV	0.05uA
73	902mV	0.04uA	902mV	0.08uA
74	891mV	0.03uA	896mV	0.09uA
75	894mV	0.04uA	891mV	0.10uA
76	891mV	0.06uA	895mV	0.05uA
77	905mV	0.08uA	900mV	0.07uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



**SeCoS Corporation**

## High Temperature Storage Life Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 150°C, 1000Hrs

Test Date: 2013.04.02 ~ 2013.05.14

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A103

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	893mV	0.06uA	897mV	0.05uA
2	902mV	0.05uA	908mV	0.07uA
3	899mV	0.02uA	895mV	0.07uA
4	890mV	0.04uA	905mV	0.05uA
5	910mV	0.08uA	902mV	0.07uA
6	895mV	0.08uA	897mV	0.06uA
7	891mV	0.10uA	897mV	0.04uA
8	895mV	0.10uA	902mV	0.03uA
9	907mV	0.07uA	906mV	0.08uA
10	905mV	0.07uA	900mV	0.04uA
11	903mV	0.09uA	900mV	0.03uA
12	903mV	0.03uA	908mV	0.09uA
13	904mV	0.06uA	895mV	0.09uA
14	910mV	0.06uA	898mV	0.06uA
15	905mV	0.09uA	908mV	0.08uA
16	898mV	0.09uA	903mV	0.05uA
17	905mV	0.08uA	892mV	0.10uA
18	902mV	0.08uA	908mV	0.07uA
19	907mV	0.05uA	904mV	0.08uA
20	907mV	0.04uA	897mV	0.05uA
21	901mV	0.08uA	892mV	0.04uA
22	892mV	0.03uA	906mV	0.06uA
23	892mV	0.04uA	897mV	0.09uA
24	903mV	0.03uA	900mV	0.06uA
25	898mV	0.07uA	903mV	0.04uA
26	894mV	0.04uA	893mV	0.05uA
27	896mV	0.10uA	897mV	0.09uA
28	902mV	0.04uA	896mV	0.09uA
29	902mV	0.03uA	903mV	0.06uA
30	908mV	0.03uA	897mV	0.06uA
31	900mV	0.05uA	904mV	0.02uA
32	907mV	0.03uA	890mV	0.09uA
33	906mV	0.09uA	903mV	0.04uA
34	901mV	0.06uA	903mV	0.09uA
35	897mV	0.03uA	901mV	0.09uA
36	893mV	0.07uA	893mV	0.08uA
37	900mV	0.09uA	891mV	0.08uA
38	905mV	0.04uA	893mV	0.08uA
39	892mV	0.04uA	906mV	0.10uA



**SeCoS Corporation**

## High Temperature Storage Life Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 150°C, 1000Hrs

Test Date: 2013.04.02 ~ 2013.05.14

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A103

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
40	903mV	0.04uA	899mV	0.06uA
41	901mV	0.07uA	900mV	0.06uA
42	898mV	0.06uA	899mV	0.07uA
43	905mV	0.09uA	909mV	0.06uA
44	896mV	0.09uA	903mV	0.04uA
45	907mV	0.03uA	893mV	0.02uA
46	891mV	0.05uA	904mV	0.10uA
47	900mV	0.07uA	897mV	0.05uA
48	903mV	0.05uA	900mV	0.08uA
49	895mV	0.08uA	906mV	0.08uA
50	908mV	0.05uA	897mV	0.08uA
51	892mV	0.09uA	905mV	0.10uA
52	910mV	0.08uA	899mV	0.10uA
53	905mV	0.09uA	895mV	0.08uA
54	898mV	0.02uA	894mV	0.10uA
55	895mV	0.03uA	893mV	0.08uA
56	896mV	0.04uA	894mV	0.10uA
57	906mV	0.05uA	891mV	0.03uA
58	890mV	0.03uA	893mV	0.05uA
59	895mV	0.08uA	899mV	0.07uA
60	897mV	0.07uA	903mV	0.02uA
61	892mV	0.10uA	906mV	0.09uA
62	907mV	0.09uA	897mV	0.10uA
63	900mV	0.09uA	892mV	0.05uA
64	904mV	0.05uA	900mV	0.08uA
65	902mV	0.07uA	893mV	0.05uA
66	899mV	0.06uA	905mV	0.08uA
67	907mV	0.10uA	902mV	0.06uA
68	904mV	0.09uA	896mV	0.10uA
69	898mV	0.05uA	897mV	0.07uA
70	892mV	0.09uA	901mV	0.08uA
71	898mV	0.02uA	907mV	0.03uA
72	904mV	0.07uA	896mV	0.07uA
73	899mV	0.04uA	895mV	0.04uA
74	909mV	0.07uA	899mV	0.07uA
75	907mV	0.07uA	899mV	0.08uA
76	903mV	0.10uA	896mV	0.06uA
77	896mV	0.09uA	902mV	0.09uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



# SeCoS Corporation

## Pressure Cooker Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 121°C, 100%RH, 29.7PSIG, 168Hrs

Test Date: 2013.04.08 ~ 2013.04.16

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A102

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	908mV	0.05uA	907mV	0.10uA
2	892mV	0.07uA	908mV	0.04uA
3	896mV	0.06uA	898mV	0.07uA
4	900mV	0.05uA	899mV	0.03uA
5	906mV	0.09uA	906mV	0.07uA
6	892mV	0.03uA	897mV	0.08uA
7	900mV	0.08uA	900mV	0.03uA
8	894mV	0.02uA	894mV	0.09uA
9	899mV	0.03uA	905mV	0.08uA
10	905mV	0.03uA	891mV	0.07uA
11	896mV	0.04uA	899mV	0.08uA
12	898mV	0.08uA	892mV	0.07uA
13	908mV	0.03uA	904mV	0.07uA
14	905mV	0.03uA	897mV	0.10uA
15	909mV	0.08uA	892mV	0.05uA
16	896mV	0.05uA	895mV	0.04uA
17	899mV	0.02uA	902mV	0.09uA
18	892mV	0.10uA	904mV	0.04uA
19	901mV	0.04uA	892mV	0.08uA
20	909mV	0.09uA	901mV	0.04uA
21	891mV	0.04uA	894mV	0.03uA
22	897mV	0.07uA	893mV	0.08uA
23	891mV	0.06uA	896mV	0.08uA
24	899mV	0.08uA	903mV	0.03uA
25	898mV	0.08uA	899mV	0.04uA
26	894mV	0.03uA	898mV	0.10uA
27	895mV	0.05uA	902mV	0.04uA
28	906mV	0.07uA	893mV	0.06uA
29	901mV	0.05uA	893mV	0.06uA
30	906mV	0.06uA	909mV	0.03uA
31	908mV	0.09uA	902mV	0.09uA
32	906mV	0.03uA	890mV	0.05uA
33	900mV	0.05uA	907mV	0.09uA
34	893mV	0.07uA	895mV	0.07uA
35	904mV	0.04uA	897mV	0.02uA
36	898mV	0.09uA	891mV	0.07uA
37	890mV	0.04uA	905mV	0.08uA
38	899mV	0.07uA	901mV	0.05uA
39	901mV	0.03uA	898mV	0.09uA
40	891mV	0.09uA	908mV	0.08uA



# SeCoS Corporation

## Pressure Cooker Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 121°C, 100%RH, 29.7PSIG, 168Hrs

Test Date: 2013.04.08 ~ 2013.04.16

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A102

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
41	891mV	0.05uA	895mV	0.04uA
42	903mV	0.03uA	892mV	0.08uA
43	891mV	0.06uA	903mV	0.08uA
44	891mV	0.07uA	903mV	0.09uA
45	897mV	0.03uA	908mV	0.03uA
46	894mV	0.03uA	897mV	0.07uA
47	908mV	0.05uA	901mV	0.05uA
48	900mV	0.02uA	899mV	0.09uA
49	907mV	0.08uA	910mV	0.02uA
50	896mV	0.06uA	900mV	0.04uA
51	893mV	0.02uA	898mV	0.10uA
52	899mV	0.09uA	895mV	0.02uA
53	905mV	0.05uA	906mV	0.03uA
54	907mV	0.05uA	897mV	0.06uA
55	894mV	0.08uA	909mV	0.06uA
56	900mV	0.08uA	893mV	0.03uA
57	892mV	0.07uA	897mV	0.06uA
58	897mV	0.09uA	903mV	0.08uA
59	905mV	0.07uA	902mV	0.04uA
60	904mV	0.04uA	898mV	0.04uA
61	902mV	0.06uA	895mV	0.07uA
62	901mV	0.08uA	896mV	0.08uA
63	909mV	0.03uA	903mV	0.09uA
64	894mV	0.05uA	904mV	0.06uA
65	909mV	0.08uA	893mV	0.05uA
66	900mV	0.09uA	895mV	0.05uA
67	903mV	0.04uA	899mV	0.07uA
68	890mV	0.10uA	906mV	0.07uA
69	907mV	0.08uA	904mV	0.06uA
70	898mV	0.02uA	905mV	0.02uA
71	902mV	0.08uA	908mV	0.07uA
72	896mV	0.09uA	894mV	0.05uA
73	892mV	0.08uA	910mV	0.07uA
74	908mV	0.06uA	893mV	0.08uA
75	892mV	0.10uA	894mV	0.03uA
76	906mV	0.08uA	896mV	0.05uA
77	900mV	0.03uA	908mV	0.10uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



**SeCoS Corporation**

## Temperature Cycle Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: -55°C/30min, 150°C/30min, for 1000 Cycle

Test Date: 2013.04.05 ~ 2013.05.28

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A104

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	896mV	0.05uA	903mV	0.03uA
2	895mV	0.10uA	904mV	0.05uA
3	904mV	0.07uA	903mV	0.05uA
4	893mV	0.03uA	906mV	0.08uA
5	897mV	0.06uA	891mV	0.02uA
6	909mV	0.02uA	902mV	0.10uA
7	891mV	0.05uA	900mV	0.02uA
8	894mV	0.04uA	907mV	0.07uA
9	908mV	0.02uA	907mV	0.09uA
10	895mV	0.10uA	902mV	0.04uA
11	893mV	0.04uA	908mV	0.04uA
12	902mV	0.04uA	900mV	0.06uA
13	908mV	0.07uA	890mV	0.04uA
14	896mV	0.03uA	897mV	0.10uA
15	902mV	0.07uA	897mV	0.04uA
16	902mV	0.07uA	895mV	0.04uA
17	903mV	0.06uA	909mV	0.06uA
18	890mV	0.09uA	897mV	0.06uA
19	899mV	0.02uA	891mV	0.06uA
20	907mV	0.08uA	897mV	0.09uA
21	906mV	0.07uA	910mV	0.04uA
22	894mV	0.09uA	904mV	0.03uA
23	907mV	0.04uA	892mV	0.05uA
24	903mV	0.09uA	899mV	0.05uA
25	906mV	0.03uA	907mV	0.04uA
26	898mV	0.03uA	907mV	0.06uA
27	906mV	0.06uA	893mV	0.08uA
28	891mV	0.08uA	896mV	0.06uA
29	904mV	0.05uA	900mV	0.06uA
30	895mV	0.04uA	890mV	0.09uA
31	898mV	0.06uA	893mV	0.05uA
32	890mV	0.07uA	901mV	0.09uA
33	904mV	0.02uA	898mV	0.08uA
34	904mV	0.09uA	904mV	0.02uA
35	895mV	0.10uA	890mV	0.04uA
36	896mV	0.03uA	897mV	0.09uA
37	895mV	0.08uA	905mV	0.07uA
38	909mV	0.06uA	902mV	0.05uA
39	907mV	0.03uA	904mV	0.03uA



**SeCoS Corporation**

## Temperature Cycle Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: -55°C/30min, 150°C/30min, for 1000 Cycle

Test Date: 2013.04.05 ~ 2013.05.28

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A104

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
40	897mV	0.06uA	890mV	0.02uA
41	903mV	0.05uA	890mV	0.07uA
42	904mV	0.04uA	893mV	0.07uA
43	904mV	0.07uA	897mV	0.03uA
44	893mV	0.08uA	902mV	0.05uA
45	908mV	0.05uA	892mV	0.08uA
46	898mV	0.07uA	899mV	0.04uA
47	894mV	0.10uA	905mV	0.04uA
48	908mV	0.05uA	906mV	0.04uA
49	906mV	0.06uA	902mV	0.08uA
50	893mV	0.09uA	903mV	0.08uA
51	894mV	0.09uA	901mV	0.09uA
52	897mV	0.06uA	907mV	0.06uA
53	896mV	0.06uA	898mV	0.05uA
54	894mV	0.06uA	895mV	0.06uA
55	902mV	0.03uA	895mV	0.04uA
56	894mV	0.02uA	909mV	0.08uA
57	905mV	0.05uA	904mV	0.04uA
58	896mV	0.05uA	904mV	0.03uA
59	898mV	0.05uA	892mV	0.03uA
60	906mV	0.10uA	899mV	0.09uA
61	899mV	0.06uA	901mV	0.08uA
62	898mV	0.03uA	900mV	0.03uA
63	894mV	0.02uA	893mV	0.04uA
64	894mV	0.04uA	902mV	0.09uA
65	897mV	0.09uA	894mV	0.08uA
66	910mV	0.04uA	902mV	0.03uA
67	901mV	0.05uA	904mV	0.09uA
68	900mV	0.05uA	893mV	0.06uA
69	898mV	0.07uA	906mV	0.04uA
70	910mV	0.07uA	890mV	0.04uA
71	903mV	0.09uA	902mV	0.09uA
72	897mV	0.04uA	906mV	0.02uA
73	900mV	0.10uA	910mV	0.07uA
74	902mV	0.08uA	893mV	0.06uA
75	907mV	0.07uA	905mV	0.05uA
76	910mV	0.03uA	899mV	0.04uA
77	891mV	0.04uA	897mV	0.03uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



**SeCoS Corporation**

## High Temperature High Humidity Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 85±2°C, 85±5%RH, 1000Hrs

Test Date: 2013.04.10 ~ 2013.05.22

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A101

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	900mV	0.07uA	897mV	0.09uA
2	893mV	0.08uA	898mV	0.03uA
3	910mV	0.05uA	904mV	0.08uA
4	906mV	0.05uA	896mV	0.04uA
5	900mV	0.02uA	899mV	0.10uA
6	897mV	0.08uA	909mV	0.04uA
7	905mV	0.03uA	892mV	0.05uA
8	897mV	0.03uA	907mV	0.07uA
9	894mV	0.08uA	902mV	0.06uA
10	897mV	0.04uA	904mV	0.10uA
11	895mV	0.10uA	902mV	0.07uA
12	899mV	0.06uA	891mV	0.08uA
13	903mV	0.09uA	908mV	0.07uA
14	895mV	0.10uA	897mV	0.07uA
15	895mV	0.09uA	897mV	0.02uA
16	903mV	0.04uA	891mV	0.03uA
17	908mV	0.08uA	902mV	0.03uA
18	901mV	0.08uA	902mV	0.07uA
19	910mV	0.03uA	903mV	0.06uA
20	903mV	0.04uA	899mV	0.06uA
21	904mV	0.09uA	902mV	0.03uA
22	894mV	0.03uA	899mV	0.10uA
23	893mV	0.04uA	895mV	0.08uA
24	908mV	0.08uA	899mV	0.06uA
25	909mV	0.10uA	901mV	0.03uA
26	903mV	0.06uA	892mV	0.05uA
27	895mV	0.09uA	907mV	0.08uA
28	904mV	0.09uA	908mV	0.08uA
29	901mV	0.04uA	906mV	0.06uA
30	897mV	0.07uA	903mV	0.04uA
31	897mV	0.04uA	895mV	0.05uA
32	907mV	0.09uA	906mV	0.02uA
33	903mV	0.08uA	909mV	0.08uA
34	899mV	0.05uA	901mV	0.09uA
35	895mV	0.05uA	891mV	0.04uA
36	909mV	0.07uA	898mV	0.10uA
37	902mV	0.07uA	908mV	0.02uA
38	900mV	0.09uA	900mV	0.05uA
39	891mV	0.06uA	895mV	0.05uA
40	910mV	0.03uA	897mV	0.04uA



**SeCoS Corporation**

## High Temperature High Humidity Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 85±2°C, 85±5%RH, 1000Hrs

Test Date: 2013.04.10 ~ 2013.05.22

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A101

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
41	909mV	0.04uA	902mV	0.10uA
42	900mV	0.02uA	908mV	0.04uA
43	895mV	0.05uA	900mV	0.04uA
44	904mV	0.09uA	910mV	0.05uA
45	897mV	0.05uA	905mV	0.08uA
46	893mV	0.08uA	893mV	0.10uA
47	893mV	0.05uA	901mV	0.03uA
48	893mV	0.06uA	904mV	0.03uA
49	895mV	0.02uA	894mV	0.03uA
50	897mV	0.07uA	905mV	0.06uA
51	905mV	0.04uA	891mV	0.04uA
52	894mV	0.05uA	905mV	0.02uA
53	908mV	0.03uA	905mV	0.06uA
54	908mV	0.03uA	891mV	0.09uA
55	904mV	0.06uA	906mV	0.07uA
56	899mV	0.06uA	909mV	0.06uA
57	906mV	0.10uA	903mV	0.09uA
58	898mV	0.02uA	893mV	0.10uA
59	907mV	0.07uA	908mV	0.03uA
60	897mV	0.02uA	902mV	0.06uA
61	903mV	0.06uA	895mV	0.03uA
62	893mV	0.09uA	904mV	0.06uA
63	906mV	0.08uA	898mV	0.09uA
64	907mV	0.07uA	905mV	0.09uA
65	904mV	0.03uA	903mV	0.10uA
66	898mV	0.08uA	910mV	0.04uA
67	904mV	0.03uA	894mV	0.08uA
68	908mV	0.10uA	894mV	0.07uA
69	899mV	0.09uA	892mV	0.09uA
70	896mV	0.06uA	908mV	0.05uA
71	900mV	0.07uA	909mV	0.06uA
72	905mV	0.03uA	907mV	0.07uA
73	906mV	0.02uA	899mV	0.10uA
74	898mV	0.09uA	897mV	0.09uA
75	899mV	0.04uA	906mV	0.07uA
76	900mV	0.08uA	906mV	0.06uA
77	904mV	0.03uA	895mV	0.09uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang



# SeCoS Corporation

## Solderability Test Data

Report No : T130402-009

Part No : MD5S

Test Equipment: JUNO Test System DTS-1000

Test Condition : VF<1.0V@IF=0.4A, IR<5uA@VR=600V

Test Condition: 270°C ± 5°C, 7 Sec ± 2Sec

Test Date: 2013.05.23 ~ 2013.05.24

Test Standard : JESD22 STANDER Method-A106

Operator: Bruce Chang

Test Result: PASS

No	Before		After	
	VF (mV)	IR (uA)	VF (mV)	IR (uA)
1	906mV	0.04uA	904mV	0.03uA
2	892mV	0.02uA	894mV	0.05uA
3	904mV	0.05uA	904mV	0.03uA
4	898mV	0.07uA	900mV	0.07uA
5	893mV	0.06uA	902mV	0.09uA
6	899mV	0.10uA	905mV	0.05uA
7	892mV	0.09uA	904mV	0.05uA
8	898mV	0.06uA	891mV	0.07uA
9	909mV	0.03uA	893mV	0.02uA
10	901mV	0.03uA	898mV	0.07uA

Made By: King Huang

Approval: Peter Yang